電子顕微鏡

• 文部科学省 MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS,

12



表面・微小部分析手法の比較



電子顕微鏡分野技術俯瞰図

分野 産業 学術	半導体関連 無機材料 半導体欠損評価 パワーデバイス センサー開発 モーター 無機固体材料表面評価 キャパシタ 酸化皮膜 配像媒体 固体照明 燃料電池 二次電池 超体物理 村科工学 超伝導線材 光電・熱電	高分子・有機合成 ライフサイエンス系 超報量・高強度材料 脂質工学 抗体医薬 再生医療 高分子材料開発 ドラッグリポジショニング 排ガス浄化触媒 バイオ創薬 電子線トモグラフィー 池 水処理 有機物形態評価 低分子創業 生体分子形態評価 電変換 物理有機化学
機能・性	能 無機固体試料の微細加工 無機固体材料の表面観察 電場分布の解析 磁場分布の解析 無機軽元素の分布解析	有機合成高分子の微細加工 傾斜透過像の観察 有機生体高分子の形態観察 有機低分子の状態観察 有機合成高分子の形態観察
技術 実用 ● 理論	電子線源 高電圧回路 真空ポンプ 真空技術 電子回路/ソフトウ: 制御工学 電磁弁制御 シンチレーター 電磁気学 システム工学 真空工学 振動制御 画像処理/トモグラフィ 第一原理計算 流体力学 トライポロジー 有限要素	ェア リソグラフィー CCDセンサー 急速凍結技術 収差補正 エネルギーフィルター 位相フィルター (ツェルニケ、ホールフリー) システム工学 コンデンサーレンズ 素法 散乱理論 磁界レンズ 電子線干渉技術



電子顕微鏡分解能と技術変遷



注目される技術

〇重要な開発課題

・ホログラフィー





(資料提供:(株)日立製作所、科学技術振興機構)

· 位相板(位相顕微鏡)

通常の明視野法では分解能を犠牲にしてデフォーカスしなけれ ば有機試料のコントラストを高くすることができないが、位相 板を使うことで分解能を損なわずにコントラストを高くするこ とができる。





300kV分析型極低温電子顕微鏡(FEG, He-ステー ジおよびエネルギーフィルター搭載)に薄膜位 相板を挿入。(a)は通常2次元像、(b)はゼルニケ 位相整2次元像(どちらもインフルエンザAウィ ルス (写真は2009生理学研究所要覧より抜粋)

・環境TEM (ETEM)

従来は電子顕微鏡で観察する際は試料を真空下にお く必要があった。近年では窒化ケイ素などの隔壁で 試料周辺部を挟み込み、試料周辺の差動排気をする ことで触媒などが機能している状態でのin situ観察 が可能になってきた。



光照射機能付き電子顕微鏡試料ホルダー(右 上)とグラフェン上のPtナノ粒子の高温 (800℃)その場超高分解能TEM観察像(右下) 資料提供:物質・材料研究機構

• 分割型検出器(8分割型)

8分割した検出器を利用し透過電子線の散乱角に よる違いを解析することで、電場や磁場の可視 化を行うことができる。



・トモグラフィー

電子線トモグラフィーは3次元再構築ルーチンの 改良により複雑な構造の再構築も短時間で行う ことが可能になった。また、近年では透過率の 違いやEDSスペクトルによるマッピングも可能に なってきている。



文部科学省 MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS,

17

位相差電子顕微鏡ロードマップ



クライオTEM





クライオTEM







クライオTEM



クライオTEM

バイオ医薬品の研究が盛んになり、核酸やタンパク質の年あ たりの登録件数は年々増加している。



※ RCSB PDB 統計データ(http://www.rcsb.org/pdb/statistics/)を元に文科省にて作成

○ 近年の登録件数の傾向について

2007年にIHRSR(Iterative Helical Real Space Reconstruction) が発表されるまでは、電子顕微鏡本体の性能が重要で電子顕微鏡 による構造生物学は国産メーカーの電子顕微鏡を使った報告がほ とんどだった。

しかし、IHRSR発表後の2013-2015では、単粒子解析の成果Top90 のうち、日本の装置が使われたものは分解能が88位の1件のみ。

OクライオTEMの分野の例

- (1) タンパクやDNA等の構造解析
 - X線結晶構造解析やNMRだけではなく、クライオTEMでも タンパクやDNAの構造解析が可能に
 - (現在のクライオTEMで決定された構造の分解能の最高 記録はFSC 2.2Å)

・一週間程度で膨大な構造解析が可能になる可能性がある。

- (2) クライオTEMの発表論文数とTEMメーカー
 - ・FEIークライオTEM 89件/90件(2013.5~2015.5)
 - ・日本電子-クライオTEM 1件/90件(2013.5~2015.5)
- ☆研究開発現場に大きな感動を与える戦略
 - →創薬ユーザーに拡がりつつある。
 - →創薬開発の現場へ

FIB-SEM/TEM





FIB-SEM/TEM

基本原理

- ・金属先端の液体金属(ガリウム等)に電界を印加することでイオンを引き出し、引き出したイオンを電圧により加速しビームとして放出する。
- ・放出されたイオンが対象試料の表面に衝突することで、表面の原子がはじきとばされるスパッタリング現象により試料を削る。
- ・放出するイオンビームはアパーチャーや集束レンズにより収束イオンビームとし、さらに偏光器により特定部位にイオンビームを収束させることができる。
- ・イオンビームが衝突した際には、二次電子も放出され、同時に二次電子像を得ることができる。
- ・イオンビーム照射部位近傍に吹き付けた化合物ガスが二次電子のエネルギーにより分解され、固体成分が試料表面に蒸着する。

効果が期待できる研究分野

- ・無機材料の超微細加工による界面構造解析
- ・無機材料の超微細加工による3次元構造解析
- 有機材料の超微細加工による構造解析
- ・ 有機材料の超微細加工による3次元構造解析

産業応用が期待される分野

- ・半導体の欠陥検出
- ・固体材料の超微細加工
- ・固体材料の表面加工

必要となる要素技術

・イオン銃 ・磁界レンズ ・静電レンズ ・高電圧回路 ・微小機械制御技術 ・半導体検出器

今後開発が期待される技術・システム

- マルチスケール観察(FIB-SEM分解能の観察とTEM分解能観察のシームレス化)
 ・試料前処理の自動化
- その他の波及効果



FIB-SEM/TEM





光学顕微鏡

